

A. DANI (*), P. GIUNTI (**), F. MENICUCCI (***)

L'INDUSTRIA MUSTERIANA DI QUERCE (FIRENZE)

Riassunto — Gli autori descrivono un'industria litica raccolta in superficie nella località Querce del comune di Fucecchio (Firenze). In base ai caratteri tecnologici e tipologici degli strumenti (impiego della tecnica Levallois, presenza di raschiatoi ad assottigliamento inverso), l'industria viene attribuita al Musteriano di facies Ferrassie.

Abstract — *The Mousterian industry of Querce (Firenze)*. In this work the Authors examine a lithic industry recovered from the surface soil in the locality of Querce near Fucecchio (Firenze). On the basis of the technological and typological aspects of the implements (Levalloisian technique and thinned scrapers), this industry is ascribed to a Mousterian of the Ferrassie type.

Key words — Mousterian industry, Middle Paleolithic, Tuscany.

INTRODUZIONE

Il sistema collinoso delle Cerbaie, nel Valdarno inferiore, fu oggetto fra il 1963 e il 1969 di una prima fase di esplorazioni di superficie che portò alla localizzazione di otto giacimenti con industrie del Paleolitico medio e superiore e del Mesolitico, che furono pubblicate nel 1973 e 1974 (PALMA DI CESNOLA e DANI, 1973; DANI, 1974). Negli anni successivi si registrò ancora un'assidua ricognizione dei giacimenti, col risultato di incrementare notevolmente la consistenza numerica dei reperti di almeno tre di essi (Bivio Montefalcone, Crocialoni e Biagioni), mentre nel sito mesolitico di Sammartina si susseguivano regolari campagne di scavo ad opera dell'Istituto di Antropologia e Paleontologia Umana dell'Università di Siena, sotto la direzione del dott. F. Martini (GHESER e MARTINI, 1985-86).

(*) Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze.

(**) Laboratorio per l'Ecologia del Quaternario, Firenze.

(***) Via Roma 219, Pontedera (Pisa).

A partire dal 1986, grazie soprattutto all'attività di uno di noi (P.G.), si è avuta un'intensificazione delle ricerche e sono stati individuati nuovi giacimenti, uno dei quali forma l'oggetto del presente lavoro. L'industria musteriana qui esaminata proviene dalla frazione Querce del comune di Fucecchio (Firenze), e fu raccolta in tre piccole concentrazioni, situate a poche centinaia di metri l'una dall'altra ed alla stessa quota altimetrica (circa m 50 s.l.m.), rispettivamente nelle località Pinete, Belvedere e Ferretto (I.G.M. 105 II N.O.). Dal punto di vista tipologico, le tre raccolte presentano fra loro tali analogie (estese perfino alla medesima altissima percentuale di strumenti in confronto ai nuclei ed ai residui di lavorazione), da convincerci della opportunità di una trattazione unitaria, pur contrassegnando i singoli strumenti con sigle differenziate di provenienza ⁽¹⁾.

La materia prima utilizzata è quella usuale del Paleolitico medio toscano, con netta prevalenza del diaspro rosso rispetto al calcare siliceo avana, al diaspro listato grigio e ad altre varietà di selce. L'industria si compone complessivamente di 82 strumenti, 64 nuclei e 165 schegge e scarti di lavorazione.

I nuclei sono suddivisibili in 21 esemplari ad un solo piano di percussione liscio, 10 discoidali (Fig. 3, n. 10), 10 a due piani di percussione perpendicolari, 4 ad un solo piano di percussione corticato, 4 poliedrici e 15 residui indefinibili. Le loro dimensioni variano da un minimo di mm 26×25 ad un massimo di mm 72×48.

Le schegge non ritoccate sono di piccole e medie dimensioni, e conservano spesso porzioni di cortice. Su 69 talloni visibili, 26 sono lisci, 24 corticati, 12 faccettati, 4 diedri e 3 scagliati.

Riserviamo agli strumenti una breve descrizione analitica ⁽²⁾.

Grattatoi, n. 3.

(B) - G2. Grattatoio frontale lungo a margini ritoccati. Tallone faccettato. L 45; l 29; s 10. (Fig. 1, n. 1).

(F) - G3. Grattatoio frontale corto. Tallone corticato. L 37; l 31; s 16. (Fig. 1, n. 2).

(F) - G4. Grattatoio frontale corto a margini ritoccati. Tallone corticato. L 29; l 26; s 9.

(1) Esse sono l'iniziale del toponimo (B per Belvedere, F per Ferretto e P per Pinete), che precede la sigla della tipologia analitica Laplace 1964.

(2) I dati numerici sono le dimensioni in millimetri (L=lunghezza; l=larghezza; s=spessore). Le cifre fra parentesi indicano le dimensioni residue degli esemplari rotti.

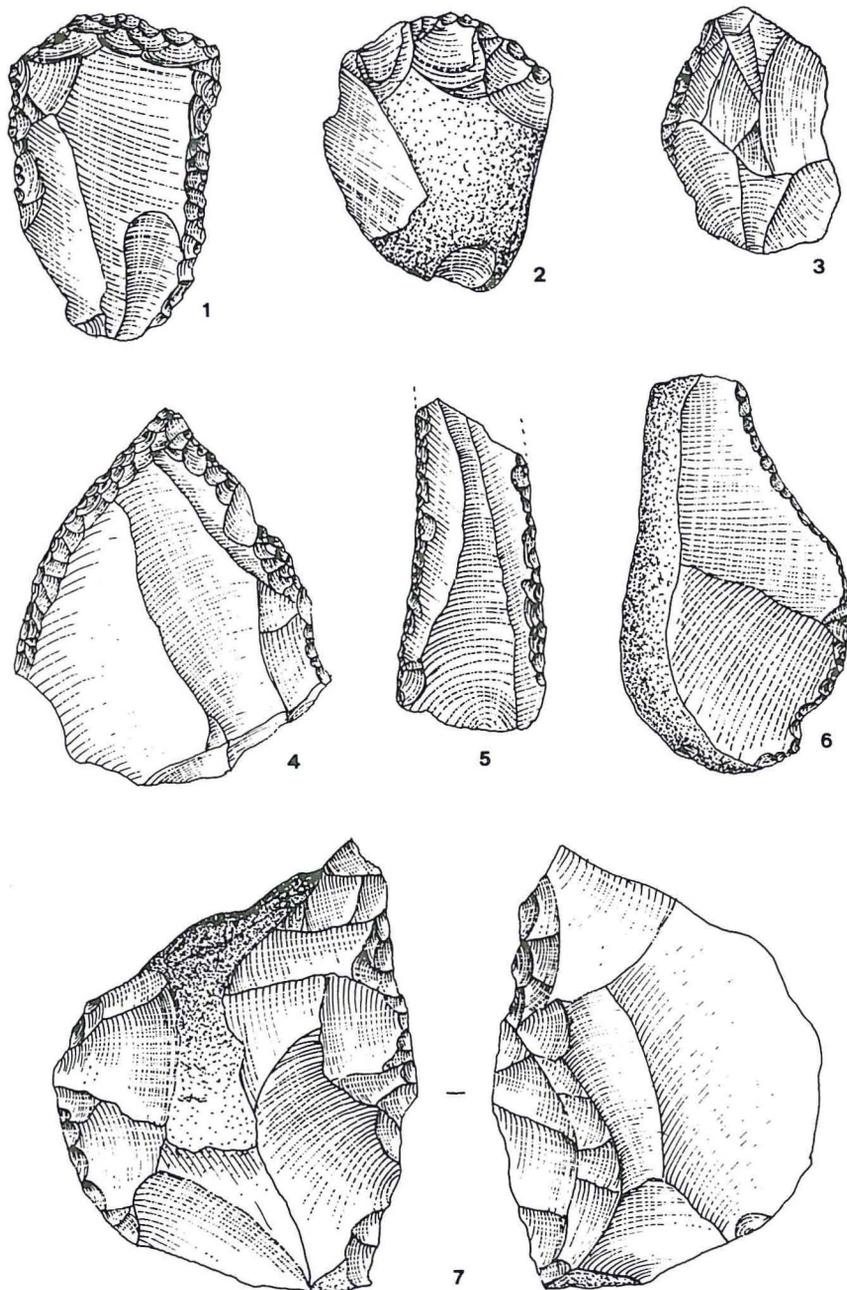


Fig. 1 - Grattatoi (nn. 1, 2), punta (n. 4), lama a ritocco bilaterale (n. 5), raschiatoi marginali (nn. 3, 6), raschiatoio bifacciale (n. 7).

Troncature, n. 3.

- (B) - T1. Troncatura marginale parziale. Tallone faccettato. L 40; l 23; s 15.
 (F) - T2. Troncatura diritta a ritocco sommario. Tallone liscio. L 56; l 33; s 11.
 (P) - T2. Troncatura diritta parziale. Tallone corticato. L 20; l 21; s 10.

Punte, n. 1.

- (B) - P2. Punta a ritocco scalariforme. Tallone faccettato. L 49; l 42; s 13. (Fig. 1, n. 4).

Lame, n. 1.

- (F) - L2. Lama Levallois a ritocco bilaterale concavo-convesso. Tallone faccettato. Apice rotto. L (44); l 21; s 6. (Fig. 1, n. 5).

Raschiatoi marginali, n. 19.

- (B) - R1. Raschiatoio marginale laterale (parziale). Tallone liscio. L 45; l 33; s 16.
 (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale (parziale). Tallone diedro. L 30; l 27; s 8. (Fig. 1, n. 3).
 (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale (parziale). Tallone liscio. L 48; l 32; s 17.
 (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale (parziale). Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 39; l 21; s 8.
 (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale (parziale). Scheggia Levallois. Tallone liscio. L 37; l 27; s 5.
 (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale (parziale). Tallone asportato. L 30; l 22; s 7.
 (F) - R1. Frammento mediano di raschiatoio marginale laterale. L (21); l 31; s 5.
 (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale. Tallone liscio. L 54; l 31; s 8. (Fig. 1, n. 6).
 (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale. Tallone liscio. L 40; l 21; s 7.
 (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale. Tallone diedro. L 41; l 37; s 8.
 (P) - R1. Frammento distale di raschiatoio marginale bilaterale. L (20); l 31; s 7.

- (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale (parziale) a ritocco inverso. Tallone liscio. L 26; l 28; s 8.
- (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale (parziale) a ritocco inverso. Tallone liscio. L 39; l 31; s 11.
- (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale a ritocco inverso. Tallone liscio. L 23; l 12; s 5.
- (P) - R1. Raschiatoio marginale laterale a ritocco inverso. Tallone liscio. L 56; l 68; s 23.
- (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale a ritocco inverso. Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 27; l 33; s 9.
- (F) - R1. Raschiatoio marginale laterale a ritocco alterno. Scheggia Levallois. Tallone liscio. L 26; l 29; s 6.
- (B) - R1. Raschiatoio marginale trasversale. L 26; l 25; s 5.
- (F) - R1. Raschiatoio marginale trasversale. Tallone corticato. L 29; l 34; s 9.

Raschiatoi profondi, n. 27.

- (F) - R2. Raschiatoio laterale diritto (sinuoso) a ritocco scalariforme. Assottigliamento inverso del margine trasversale. Tallone corticato. L 50; l 46; s 17. (Fig. 2, n. 1).
- (F) - R2. Frammento distale di raschiatoio laterale diritto a ritocco scalariforme. L (36); l 32; s 7.
- (B) - R2. Frammento distale di raschiatoio laterale diritto a ritocco lamellare. L (26); l 20; s 4.
- (F) - R2. Frammento prossimale-mediano di raschiatoio laterale diritto. Tallone corticato. L (38); l 26; s 9.
- (F) - R2. Raschiatoio laterale diritto. Tallone asportato. L 55; l 34; s 20.
- (B) - R2. Raschiatoio laterale diritto. Tallone asportato. L 39; l 29; s 13. (Fig. 2, n. 3).
- (F) - R2. Raschiatoio laterale convesso a ritocco scalariforme. Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 51; l 35; s 8. (Fig. 2, n. 6).
- (P) - R2. Frammento prossimale di raschiatoio laterale convesso a ritocco scalariforme. Tallone faccettato. L (26); l 30; s 7.
- (F) - R2. Raschiatoio laterale convesso. Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 37; l (28); s 5.
- (F) - R2. Raschiatoio laterale convesso a ritocco scalariforme. Tallone faccettato. L 36; l 27; s 11.
- (B) - R2. Raschiatoio laterale convesso. Tallone faccettato. L 38; l 24; s 7.
- (F) - R2. Raschiatoio laterale convesso a ritocco scalariforme. Tallone diedro. L 37; l 25; s 8. (Fig. 3, n. 3).

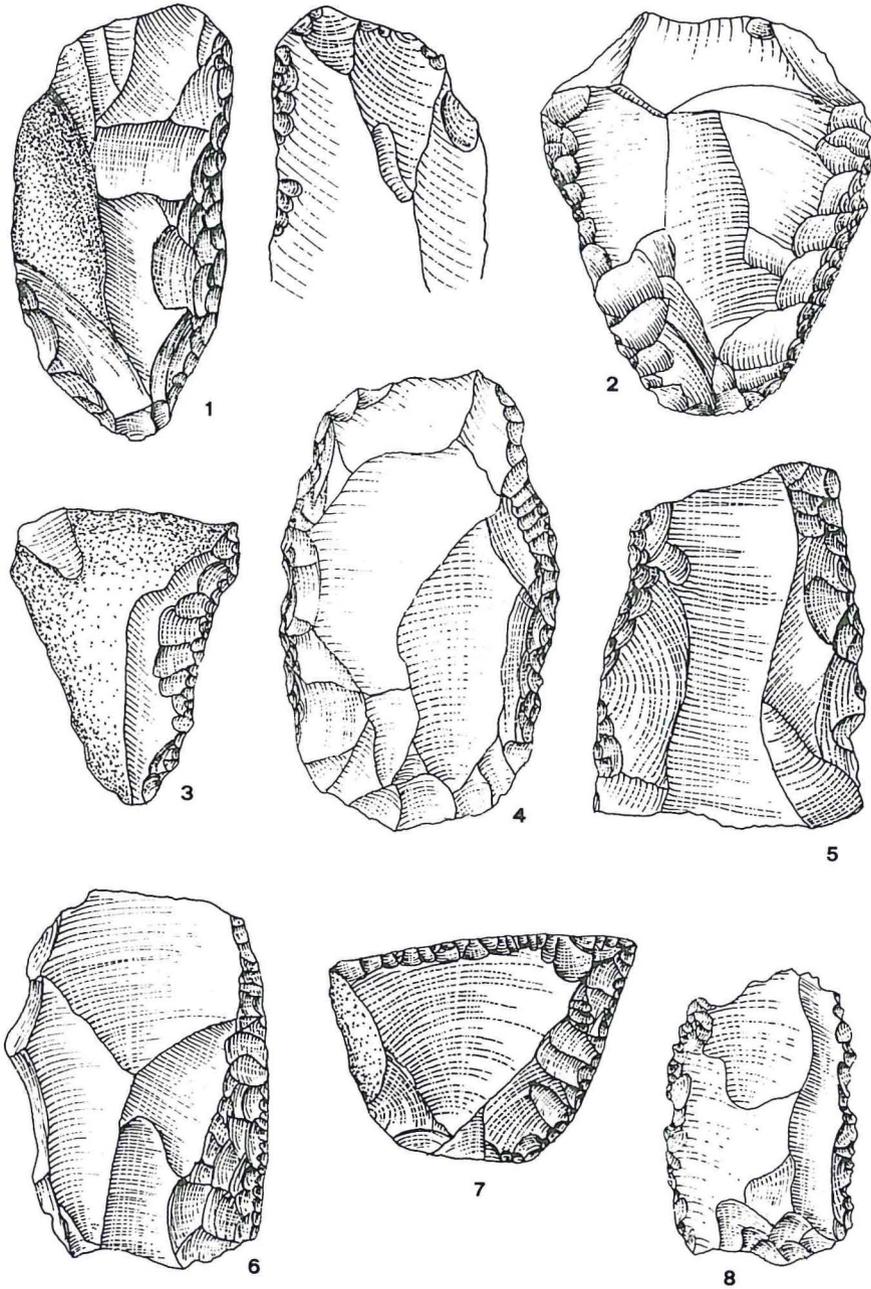


Fig. 2 - Raschiatoi laterali (nn. 1/6), raschiatoio latero-trasversale (n. 7), raschiatoio denticolato (n. 8).

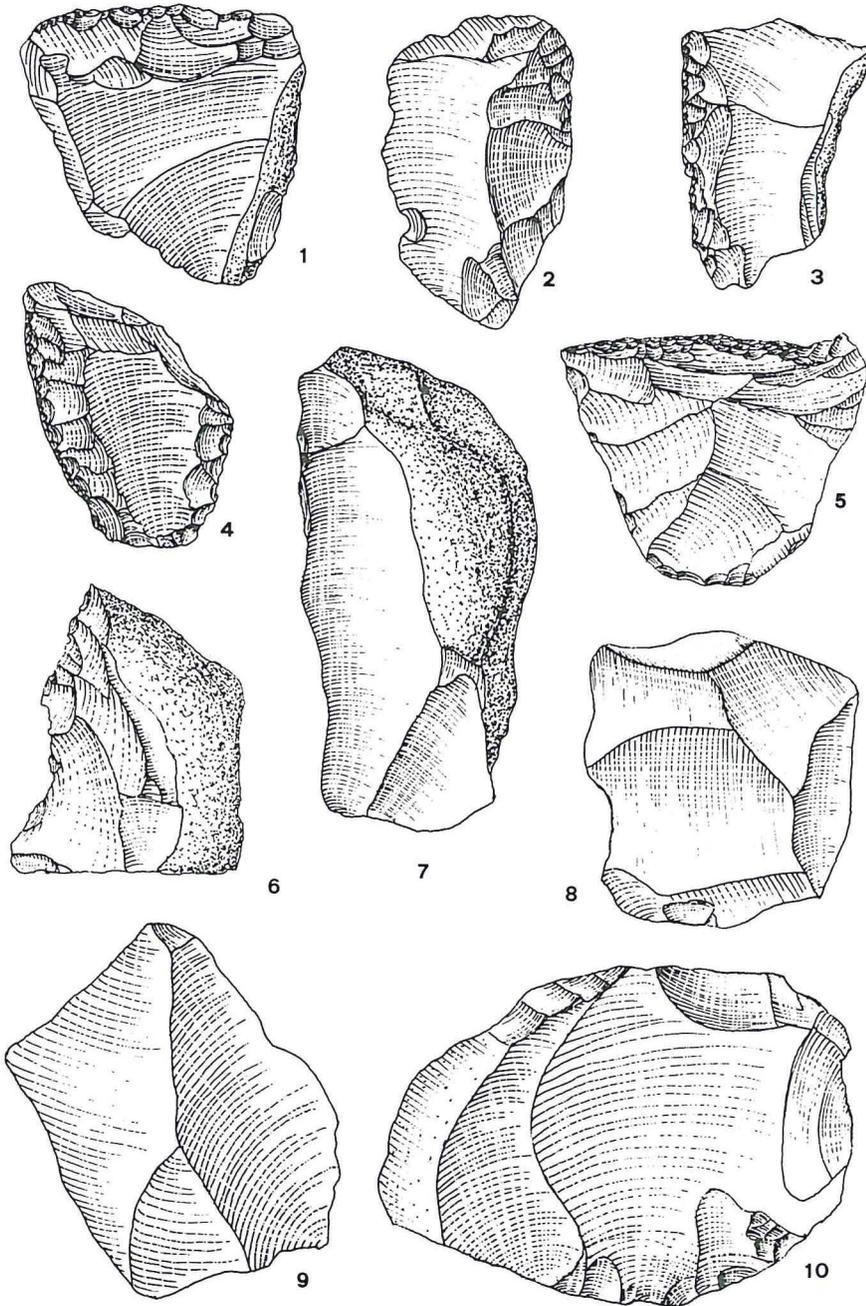


Fig. 3 - Raschiatoi laterali (nn. 3, 4), raschiatoio trasversale (n. 1), raschiatoio carenato (n. 5), raschiatoio denticolato (n. 6), scagliato (n. 2), schegge Levallois (nn. 8, 9), coltello a dorso naturale (n. 7), nucleo discoidale (n. 10).

- (F) - R2. Raschiatoio laterale convesso. Scheggia Levallois. Tallone liscio. L 39; l 35; s 6.
- (F) - R2. Raschiatoio laterale convesso a ritocco scalariforme. Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 38; l (33); s 10.
- (P) - R2. Frammento prossimale di raschiatoio laterale convesso. Tallone faccettato. L (23); l 33; s 7.
- (B) - R2. Raschiatoio laterale convesso a ritocco bifacciale. Tallone corticato. L 59; l 49; s 22. (Fig. 1, n. 7).
- (B) - R2. Raschiatoio bilaterale convesso a ritocco lamellare. Tallone liscio. L 32; l 31; s 9. (Fig. 3, n. 4).
- (B) - R2. Raschiatoio bilaterale convesso a ritocco scalariforme. Tallone corticato. L 52; l 37; s 14. (Fig. 2, n. 5).
- (F) - R2. Raschiatoio bilaterale convesso. Scheggia Levallois. Tallone diedro. L 59; l 42; s 12. (Fig. 2, n. 4).
- (F) - R2. Raschiatoio bilaterale diritto-convesso a ritocco scalariforme. Scheggia Levallois. Tallone asportato. Assottigliamento inverso del margine trasversale. L 54; l 43; s 13. (Fig. 2, n. 2).
- (F) - R3. Raschiatoio trasversale convesso. Tallone corticato. L 46; l 43; s 18.
- (F) - R3. Raschiatoio trasversale convesso. Tallone liscio. L 39; l 37; s 11. (Fig. 3, n. 1).
- (B) - R4. Raschiatoio latero-trasversale a ritocco scalariforme. Tallone liscio. L 36; l 38; s 10.
- (B) - R4. Raschiatoio latero-trasversale a ritocco scalariforme. Tallone faccettato. L 24; l 29; s 11.
- (B) - R4. Raschiatoio latero-trasversale a ritocco scalariforme. Tallone liscio. L 59; l 63; s 10.
- (B) - R4. Raschiatoio latero-trasversale a ritocco lamellare. Tallone liscio. L 31; l 41; s 7. (Fig. 2, n. 7).
- (F) - R5. Raschiatoio carenato a ritocco scalariforme. Scheggia non orientabile. L 40; l 39; s 18. (Fig. 3, n. 5).

Erti, n. 2.

- (F) - A1. Scheggia a ritocco erto marginale. L 35; l 31; s 16.
- (F) - A1. Scheggia a ritocco erto marginale. L 24; l 23; s 6.

Denticolati, n. 14.

- (B) - D1. Incavo marginale. Scheggia Levallois. Tallone asportato. L 28; l 17; s 5.
- (B) - D1. Incavo marginale. Tallone diedro. L 30; l 29; s 10.

- (F) - D1. Incavo profondo. Tallone liscio. L 57; l 37; s 11.
 (B) - D1. Incavo profondo. Tallone liscio. L 17; l 17; s 7.
 (P) - D2. Raschiatoio denticolato marginale. Tallone liscio. L 29; l 17; s 6.
 (F) - D2. Raschiatoio denticolato marginale. L 49; l 46; s 20.
 (P) - D2. Raschiatoio denticolato marginale. Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 36; l (35); s 8.
 (B) - D2. Raschiatoio denticolato marginale bilaterale. Tallone diedro. L 40; l 26; s 9. (Fig. 2, n. 8).
 (F) - D2. Raschiatoio denticolato marginale trasversale. L 34; l 30; s 19.
 (F) - D2. Raschiatoio denticolato profondo. L 38; l 30; s 17. (Fig. 3, n. 6).
 (F) - D2. Raschiatoio denticolato profondo. Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 32; l 28; s 9.
 (F) - D2. Raschiatoio denticolato profondo. Tallone liscio. L 25; l 28; s 6.
 (P) - D2. Raschiatoio denticolato profondo. Tallone corticato. L 35; l 22; s 14.
 (F) - D6. Raschiatoio denticolato carenoide. L 23; l 20; s 11.

Scagliati, n. 3.

- (B) - E1. Scheggia a ritocco scagliato profondo laterale. L 42; l 27; s 9. (Fig. 3, n. 2).
 (P) - E1. Scheggia a ritocco scagliato profondo latero-trasversale. L 50; l 28; s 19.
 (B) - E1. Scheggia non orientabile a ritocco scagliato profondo. L 28; l 22; s 10.

Diversi, n. 9.

- (F) - Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 39; l 32; s 9.
 (B) - Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 43; l 35; s 6.
 (B) - Scheggia Levallois. Tallone liscio. L 40; l 36; s 10. (Fig. 3, n. 8).
 (F) - Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 29; l 28; s 9.
 (B) - Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 50; l 42; s 15. (Fig. 3, n. 9).
 (F) - Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 37; l 38; s 6.
 (F) - Scheggia Levallois. Tallone faccettato. L 34; l 39; s 9.
 (P) - Punta pseudo-Levallois. Tallone faccettato. L 31; l 33; s 8.
 (F) - Coltello a dorso naturale. Sbrecciature d'uso sul margine tagliente. Tallone liscio. L 64; l 34; s 19. (Fig. 3, n. 7).

OSSERVAZIONI

Nella sua modesta rilevanza quantitativa, l'industria musteriana di Querce appare essenzialmente caratterizzata da un buon impiego della tecnica Levallois, con conseguente realizzazione di strumenti su schegge sottili a tallone frequentemente faccettato (ILty 28). In cinque casi si osserva l'asportazione intenzionale del tallone.

La percentuale dei raschiatoi è piuttosto alta (IR 57,3), mentre risulta scarsa la presenza di denticolati. Il numero dei manufatti ci è parso insufficiente per l'elaborazione di altri indici tipologici attendibili. All'interno del gruppo dei raschiatoi, si segnala una certa concomitanza di elementi «arcaici», quali il bel raschiatoio laterale a ritocco bifacciale, i trasversali ed i latero-trasversali. Numerosi sono pure i raschiatoi bilaterali. Il ritocco è sempre eseguito in maniera esemplare; spesso è scalariforme, in qualche caso lamellare.

Caratteristiche analoghe si riscontrano nei materiali del vicino giacimento di Biagioni, alquanto accresciutisi dopo la pubblicazione (DANI, 1974). Notevoli concordanze sono pure rilevabili con i reperti musteriani di alcuni giacimenti del circondario di Firenze, ed in particolare Poggio Piazza Calda, Poggio Cigoli e La Romola (Cocchi, 1951; CUDA e SARTI, 1985), che hanno restituito strumenti di fattura molto accurata, di frequente su supporti sottili di tecnica levalloisiana. La sola marcata discordanza è rappresentata dall'incidenza delle classiche punte musteriane, che sono quasi assenti nell'industria di Querce.

La ricerca di confronti, più che verso il Musteriano tipico, orienterebbe nel senso dei complessi charentiani del gruppo «Quina orientale» (che preferiremmo continuare a denominare con il vecchio termine di Ferrassie), diffusi in Provenza e nell'Italia settentrionale, con caratteri laquinoidi molto attenuati, forte attestazione della tecnica levalloisiana e presenza di raschiatoi bifacciali, trasversali e latero-trasversali. I tipici raschiatoi a margine assottigliato mediante ritocco inverso, sono documentati da due esemplari nella piccola raccolta di Querce, mentre figurano con maggiore frequenza fra i materiali dei vicini giacimenti di Biagioni e Crocialoni (DANI, 1984 e 1989).

Sul tipo di stanziamento rivelato dalle tre concentrazioni di Querce, le più recenti indagini in materia (MEIGNEN e TEXIER, 1986), indurrebbero a riconoscervi degli accampamenti stagionali di cacciatori, caratterizzati appunto da un ridotto quantitativo di reperti, con

alta percentuale di strumenti rifiniti in confronto ai nuclei ed agli scarti di lavorazione.

BIBLIOGRAFIA

- COCCHI P. (1951) - Nuovi giacimenti paleolitici in Toscana. *Riv. Sc. Preist.*, **6**, 49-77.
- CUDA M.T., SARTI L. (1985) - Poggio Piazza Calda. *Archivio di Tipologia Analitica*, **13**, 26-37.
- DANI A. (1974) - Stazioni paleolitiche di superficie sulle colline delle Cerbaie (Valdarno inferiore). *Riv. Sc. Preist.*, **29**, 305-336.
- DANI A. (1984) - Crocialoni. *Preistoria del Valdarno inferiore fiorentino*, 53-54, Empoli.
- DANI A. (1989) - Il giacimento paleolitico di Crocialoni. *Erba d'Arno*, **38**, 38-46, Fucecchio.
- GHESE N., MARTINI F. (1985-86) - Il Mesolitico di Sammartina (Firenze). *Riv. Sc. Preist.*, **40**, 137-199.
- MEIGNEN L., TEXIER P.J. (1986) - L'interpretazione dei siti del Paleolitico medio. *I cacciatori neandertaliani*, 80-83, Ed. Jaca Book, Milano.
- PALMA DI CESNOLA A., DANI A. (1973) - Segnalazione di una industria sauveterroide a Sammartina (Fucecchio-Firenze). *Atti XV Riun. Scient. I.I.P.P.*, 59-68, Firenze.

(ms. pres. il 30 marzo 1993; ult. bozze il 16 maggio 1994)